

化合物へテロ接合界面歪の可視化

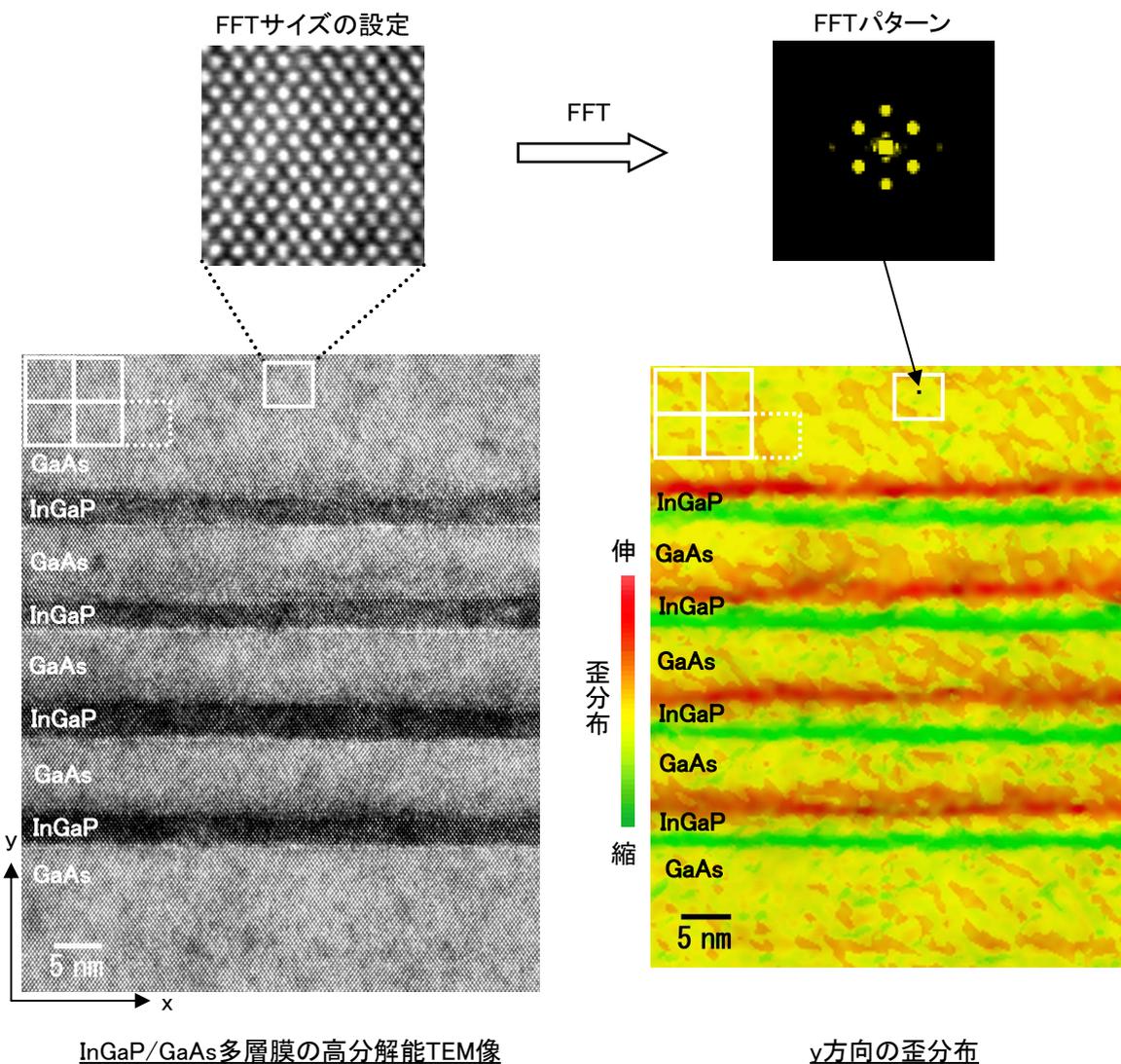
FFTM法による格子像解析

測定法 : TEM
製品分野 : 照明・光デバイス
分析目的 : 構造評価・応力・歪み評価

概要

Fast Fourier Transform Mapping法は、高分解能TEM像をフーリエ変換し、FFTパターンからのスポット位置から結晶の微小な格子歪みを解析、可視化する方法です。FFTM解析により、①画像のx, y方向の格子歪みの解析、②結晶面方向の格子歪みの解析、③結晶面間隔分布、結晶面方位分布の解析、④データ分布のヒストグラム表示、⑤空間分解能 5nmで0.5%の歪の検出、が可能です。化合物へテロ接合多層膜試料に適用した例を示します。

データ



サンプルご提供: 東京大学 霜垣 幸浩 先生

分析サービスで、あなたの研究開発を強力サポート!

一般財団法人
MST 材料科学技術振興財団

TEL : 03-3749-2525 E-mail : info@mst.or.jp
URL : <http://www.mst.or.jp/>